



	Autor/Departament	Dia /hora /lloc	Tribunal/Director
Electron Microscopy analysis of semiconductor nanowire complex structures: from axial and coaxial quantum wells to local stacking transformations in atomic structures	SONIA CONESA BOJ Electrònica	<b>Dia:</b> 11 de març de 2011. <b>Hora:</b> 11,00 hores. <b>Lloc:</b> Sala de graus, Facultat de Física.	<b>President:</b> Dr. Pere Roca i Cabarrocas <b>Secretari:</b> Dr. Albert Cornet Calveras <b>Vocal:</b> Dra. Anna Foncuberta i Morral <b>Suplents:</b> Dr. Albert Romano Rodríguez Dra. Marie-Hélène Chambrier Dra. Sònia Estradé Albiol <b>Directors:</b> Dra. Francesca Peiró Martínez Dr. Jordi Arbiol i Cobos